

高温用デバイス試験治具②

要望の
ポイント

■ 必要な試験が出来ず困っている

- 半導体デバイスの加速寿命試験で取り付けが簡単に出来る治具がほしい。
- 恒温槽内でデバイスが実装された状態でピンに電圧を並列に印可出来ることが条件。

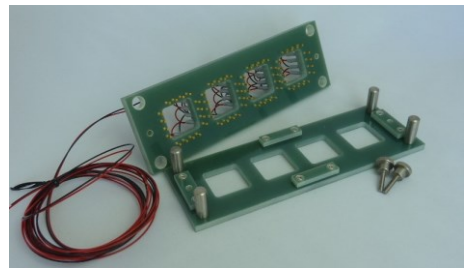
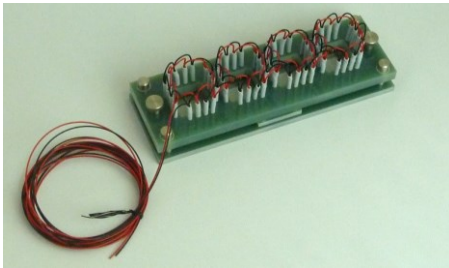
■ ご提案

デバイスが実装された基板上のランドにコンタクトプローブを介して電圧が印可出来るような治具を製作。



ココも
ポイント

加速寿命試験の高温・高湿環境に耐えうる材料で製作



■ お客様の声

- 大がかりな試験システムを構築しなくても簡単に半導体デバイスの実装状態での試験が出来るので非常にコストパフォーマンスが良い。